デジタルX線ラジオグラフィ - CR法による出土遺物への応用-

はじめに 出土遺物の内部構造調査は、従来からX線透 過写真法によるアナログ画像の解析によっておこなわれ てきた。近年、デジタルX線ラジオグラフィが開発され、 X線CT法やCR法が文化財分野にも利用されつつある。

CR (Computed Radiography) は、従来のフィルムにか わり放射線エネルギーメモリ型二次元センサーとしてイ メージングプレート (LP.) を検出系に利用する方法で、 エネルギーサブトラクションが可能なこと、フィルム法 に比べてダイナミックレンジが大きく、かつ感度が100 倍以上向上したため、小線量で、かつ短時間での撮影が 可能となり、遺物に与える影響がほとんど無視できる。 本報告では若干の実験と、出土遺物への応用を試みたの で報告する。

CR装置について 実験に使用した装置は、X線拡大撮 像システム(µFX-1000)とイメージング・アナライザー(IP. 読み取り装置:BAS-5000)で構成する。画像の構築には、被写 体試料にX線を照射してI.P.に蓄積したエネルギーをレ ーザ照射励起(He-Neレーザ:632.8nm¹⁰)によって輝尽発光 (PSL)させ、それを光電管(PMT)で検出して電気信号に 変換(log amp)した後、A/D変換してデジタルデータとし て画像を構築する方法である(図15)。なお、X線拡大撮像 システムは実効焦点が8µm²⁰の超微焦点管を使用してい るため、最大で10倍率の拡大が可能である。 実験の方法と試料 まず、X線テストチャート(JIS・ M-4Au30R相当)を用いて、フィルム法とCR法における 空間分解能を比較した。フィルム法は密着撮影、CR法 は拡大倍率10倍で画像の構築をおこなった。次に、IP. の特性を知るため被写体物質の厚さとPSL値³³の関係を 調べ、さらに厚さが一定で異なる材質の試験体を使用し て、物質密度とPSL値の関係を調べた。出土試料への応 用として、根来寺御院跡出土金製飾り金具、ガラス小玉 についての構造調査とその図化をおこなった。

結果と考察 X線テストチャートを利用して分解能を調べた結果、テストピースを密着してフィルムに撮影した ものを拡大した画像と、CR法 (10倍拡大)によって撮 影したものを比較したところ、フィルム法では50µm間 隔のスリットが識別できなかったが、CR法ではその間 隔は明瞭に識別され、ほぼ10µm程度の物質の識別が可 能で、微小な遺物の構造調査には十分な分解能が得られ ることを示した。

図16は、同一物質における被写体物質の厚さとPSL値 の関係を示したものである。PSL値は照射線量に換算さ れているので、X線強度の関数として考えることができ る。いま、同一材質で厚さtを透過したX線強度をIとす ると、厚さtとX線強度Iの間にはI=Io EXP (- λ t) が成 り立つ (Ioはtが0の場合のX線強度、 λ は減弱係数)。鉄を用 いた試料厚さとPSL値の間にはf(x) =87.4·EXP (-0.9·x) となる関係式が成り立った。これらの結果から、同一材 質であれば、標準試料校正によって厚さを求めることも



図15 I.P.から画像情報の読み取り方法 (宮原淳二 1987)



可能であることを示した。ただし、試料の厚さがある範 囲内でないとその精度は悪くなることも同時に示した。 しかし、定性的に同一材質の物体の厚さ変化を画像上で とらえることは容易にできる。その例として根来寺御院 跡出土金製飾り金具(Au:85-86wt%、Ag:14-15wt%)のCR イメージを図17に示した。フィルム法では濃淡の識別が 困難であったが、CR法による画像処理において厚さが 不均一であることが明瞭にとらえられた。特に、蟹の右 手足部分は顕著に厚さの変化が示されている(肉眼的観 察では識別不可能)。

図18は同一厚さ物体における物質密度とPSL値の関係 について調べたものである。同一厚さであれば、PSL値 の測定から密度を計算して、物質の同定が可能であるこ とを示しているが、複雑な要素をもつ文化財資料に応用 するには多くの問題点をかかえていることも事実である。



図17 根来寺御院出土金製飾り金具

材質の推定は、物質の厚さに関わりなく物質密度の測定 が可能なX線CT法のほうがはるかに有利である。

図19、図20はガラス小玉(古墳時代)を撮影した一例であ る。金層ガラス(約5mm径)は、二重のガラス管によって作 られており、内側のガラス層に残存する気泡の軌跡から 製作技法の解明が可能となる。また、微小な小玉(径:1mm、 長さ:1.5mm)もガラス管を引き伸ばして、それを切断し て製作されたことが明瞭にとらえられた。いずれも日本 で出土するインドパシフィック系ビーズの特徴を示して いる。 (肥塚隆保)

1) 1 nm (+ / - + n) = 1 / 1,000,000 mm

- 2) 1 µm (マイクロメートル) = 1/1,000mm
- 3) PSL値:イメージング・アナライザーにより対数値で読み取られた画 像データを諧調分割した値をQL値と言い、このQL値をもとに感度・ ラチチュード・諧調(bit数)を設定して演算をおこない直線的な関 係に戻した値。



図19 金属ガラスとそのCR画像 (CR画像をもとにエッジ検出処理により画像を再構築)



図20 微小なガラス小玉のCR画像(拡大)



図18 物質密度とPSL値の関係